

High Voltage Electron Microscopy Study on Microstructure Evolution in Yttria-stabilized Cubic Zirconia

ブイアン, エイケイエム サイフル イスラム

<https://hdl.handle.net/2324/1785406>

出版情報：九州大学, 2016, 博士（工学）, 課程博士
バージョン：
権利関係：全文ファイル公表済



氏 名	AKM Saiful Islam Bhuian			
論 文 名	High Voltage Electron Microscopy Study on Microstructure Evolution in Yttria-stabilized Cubic Zirconia (超高压電子顕微鏡法による立方晶安定化ジルコニアの微細構造発達に関する研究)			
論文調査委員	主 査	九州大学	准教授	安田 和弘
	副 査	九州大学	教授	松村 晶
	副 査	九州大学	准教授	渡邊 英雄

論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨

本研究は、放射線照射により立方晶安定化ジルコニア中に形成される照射欠陥の性状、ならびに形成・成長過程を陽および陰イオンのはじき出し損傷速度を制御した超高压電子顕微鏡内「その場」観察法により詳細に調べ、その微細組織発達機構に関する重要な基礎的知見を得た価値ある業績であり、原子炉材料学ならびに材料物性工学に寄与するところが大きい。よって、本論文は、博士(工学)の学位論文に値するものと認める。